有機積層型イメージセンサ -完全同時広ダイナミックレンジ技術,光電変換グローバルシャッタ技術の開発-

Development of Simultaneous-Capture Wide-dynamic-range Technology and Global Shutter Technology for Organic Photoconductive Film Image Sensor

村	上	雅	史	西村佳壽子	宍 戸 三 四 郎
Masashi Murakami				Kazuko Nishimura	Sanshiro Shishido
高	瀬	雅	之	三 宅 康 夫	玉 置 徳 彦
Masayuki Takase				Yasuo Miyake	Tokuhiko Tamaki

要

旨

筆者らは、有機イメージセンサの光電変換部と信号処理回路部が積層され独立に設計可能な構造の特長を活 (い)かした性能・機能の飛躍的な伸張技術により新たな顧客価値の創造に取り組んでいる。今回、画素電極を1 画素内で大小に分割した1画素2セル構造の提案により、従来技術課題であった時間ずれのない、1回の撮像で120 dB超の完全同時広ダイナミックレンジ技術を開発した。また、有機光電変換膜に印加する電圧を変化させること で光電変換効率を制御する技術の開発により、従来技術課題であった画素サイズと飽和のトレードオフ特性を飛 躍的に改善し、従来比10倍の業界最高飽和グローバルシャッタ機能を実現した。これら有機イメージセンサの広 ダイナミックレンジ化技術とグローバルシャッタ技術開発により、明暗差の大きなシーンでの撮影や、高速に移 動する被写体認識、動き方向検出を可能とし、新たなイメージセンシング用途への展開・拡大を目指す。

Abstract

We are trying to effectively offer greater value to customers and developing technology to dramatically enhance performance and functions utilizing the structural feature of organic photoconductive film (OPF) image sensors. In these sensors, the photoelectric conversion part and signal processing circuits are vertically stacked and they can be designed independently. We have proposed and developed a dual-sensitivity pixel utilizing this unique feature of the OPF CMOS image sensor. It realizes a simultaneous wide-dynamic-range image capture of over 120 dB without time distortion. Photoelectric-conversion-controlled global shutter technology has also been developed by only modulating the voltage applied to OPF. It has improved the tradeoff performance and realized a high-saturation signal up to 10 times larger than the conventional image sensors. These technologies enable high-speed, high-precision imaging without time distortion in high-contrast scenes, and will be applied to new imaging and sensing devices.

1. はじめに

イメージセンサにおいて近年その性能向上に伴い,こ れまでの撮像用途に加えて監視,車載,産業,ロボット といったセンシング分野が注目を集めており,新たなイ メージング市場への需要が期待されている.また,屋外 での利用シーンも拡(ひろ)がり,高感度,高解像度に 加えて,逆光時にも確実にセンシングするダイナミック レンジ拡大やLED標識のフリッカ課題克服などロバスト 性の高いセンシング技術の要求が高まっている.

CMOSイメージセンサ(CMOS Image Sensor: : CIS)に おいては、高解像度、高フレームレート、高感度の特長 でCCDに替わって撮像素子の主流となってきた.しかし ながら CISでは、露光やシャッタ動作を全画素同時では なく、行ごとに順次走査し行う特有のローリングシャッ タ動作を伴う.CCD同様に全画素同時にシャッタをきる ため、画像歪(ひずみ)を生じないグローバルシャッタ 動作には、画素部に新たなメモリーの追加が必要となり、 受光面積縮小による飽和性能の低下などから、限られた 用途に留(とど)まっていた[1]-[4].撮像用途において も、ミラーレス一眼などのメカシャッタレス化への要求 もあり、小型、高精細、広ダイナミックレンジでかつ、 グローバルシャッタ動作が可能なセンサが期待されてい る.

今回, CCDとCMOSイメージセンサの特長を兼ね備え, 時間ずれのない1回の撮像で120 dBを超えるワイドダイ ナミックレンジ (WDR: Wide Dynamic Range) 撮像と動 体・文字の認識や動き方向を検出する独自のグローバル シャッタ機能を実現する有機CMOSイメージセンサを開 発したので報告する.

2. 画素構造と光電変換の原理

従来CISの構造図を第1図(a) に示す. 図に示すよう に従来CISは光電変換部となるPD(Photo Diode)と信号 電荷を読み出す浮遊拡散容量FD(Floating Diffusion)が 同一シリコン基板上に形成されるため, FD領域が狭くな る. そのため逆光時にはFD領域の信号電荷は溢(あふ) れ,ダイナミックレンジが狭い. また高い感度を得るた めには, PDを深く形成する必要があるが,第1図(b)に 示す隣接画素への光の漏れ込みによる混色課題や, 混色 を抑制するためのPD上層のメタルシールドによる集光 ロスが生じる.

一方,有機イメージセンサの画素断面模式図を第2図 (a)に示す.有機イメージセンサは従来CISとは異なり, 光電変換部をCMOS チップに設けられた読み出し回路 部上に積層し,それぞれ上下独立な領域に形成可能なこ とから,受光面積の圧迫なく広い回路領域を得ることが できる.センサに入射した光は画素ごとに設けられたマ イクロレンズ,カラーフィルタを介して有機光電変換膜 (OPF)に吸収され,電子正孔対が生成される.発生し た正孔は有機光電変換膜に印加される電界強度に応じて 電極側に引き抜かれ,信号電荷としてシリコン基板上に 形成した浮遊拡散容量FD部に蓄積される.

この積層構造により広いFD領域に多くの信号電荷を 蓄積することができ、広ダイナミックレンジ化を実現す る.また、高い光吸収率を有する有機薄膜により、広い 開口で混色を抑制した高感度な撮像性能を有する[5]-[7].

光電変換効率は第2図(b)に示すように、有機光電変換膜上部の透明電極ITO(Indium Tin Oxide)に印加する 電圧により制御することが可能となる.筆者らは、この 有機イメージセンサ特有の積層構造と、電圧により光電





第2図 有機積層型イメージセンサ

Fig. 2 Organic photoconductive film image sensor

変換特性が制御可能な点に注目し、有機センサの特長を 飛躍的に伸張する新たな技術開発を行った.

3.120 dB超の完全同時WDR技術の開発

従来のCMOS イメージセンサでは,露光時間の異なる 複数のデータを順次撮影後,撮影した複数の画像を合成 することで,ダイナミックレンジ拡大を図っていたが, 時間差のある複数画像データを処理するため,動体画像 は歪(ゆが)んでしまうという課題があった.そこで筆 者らは**第3図 (a)** に示すような,有機イメージセンサの 積層構造の特長を活かした1画素2セル構造の提案を行っ た.

3.1 1画素2セル 基本画素構成

1画素2セルの画素構成として,有機光電変換膜の画素 電極面積による集光感度比10倍と信号電荷の蓄積容量比 を10倍とすることで,従来のSiセンサ比で約100倍のワイ ドダイナミックレンジ撮像を実現する.

1画素2セル構造では,**第3図**(b)に示すように光電変換した信号電荷を収集する有機光電変換膜下の画素電極を大小:PE1/PE2に分割する.暗時被写体を捉える高感度セルの画素電極は,感度向上のため大面積とし画素の中心部に配置し,明時被写体を捉える高飽和セルの画素



第3図 1画素2セル画素構造 Fig. 3 Dual-sensitivity pixel structure

電極は高感度セル境界部に小面積としている.センサに 入射した光は、この画素電極サイズに応じた信号量がそ れぞれの画素電極に収集される.

さらに、高飽和セルは飽和電荷量を拡大する大きな電 荷蓄積容量CSを搭載している.本画素構成により、有機 光電変換膜の画素電極面積による集光感度比10倍と、容 量CSによる飽和電荷蓄積容量比10倍により、従来のCIS 比で約100倍の広ダイナミックレンジ撮像が実現可能と なる.

3.2 有機積層センサ固有のノイズ課題の解決

有機センサの積層構造は集光感度比や,飽和電荷量の 拡大に対して有効である一方,光電変換部である有機薄 膜と信号蓄積部であるSi基板が金属配線を介して接続さ れるため,信号電荷をリセットする際に発生するノイズ がCCDやCMOSイメージセンサに対して固有課題となる.

ノイズは**第3図(c)**の回路図に示す信号蓄積部(FD) をRSTトランジスタで信号蓄積部FDをリセットする際 に発生する.このノイズを抑制するために,FD部で発生 したノイズの逆相の信号をFBAMP(Feed Back AMP)に よりFD部へフィードバック(負帰還)することでキャン セルすることができる.FBAMPを用いてノイズを抑制す る技術は幾つか提案されているが、ノイズを高速に抑制 することが課題であった[6],[8].そこで今回,「容量結合 型ノイズキャンセル回路」を新たに開発した.

回路は4トランジスタ(増幅用SF Tr, 選択用SEL Tr, リセット用RST Tr, フィードバック用FB Tr), 2容量(安 定化容量Cs, カップリング容量Cc)から構成される.本 回路では、ノイズキャンセル時の負帰還ループのゲイン

(Negative Feedback Gain) を-Aとした場合に,RST Trの ノイズを元の値の1/(A×Cc/Cfd),FB Trのノイズを1/ $\sqrt{$ (A×Cs/Cc)まで抑制できる.AかつCs/Ccを大きく設計す ることで,ノイズは5 μ sの時間で電子数25e-から1.6e-まで 抑制可能となる.また,Ccを用いてFDと分離されたFB Tr を制御することで,負帰還制御のロバスト性を向上し, 高速かつ安定したノイズキャンセルを実現することがで きる.

4. 光電変換制御グローバルシャッタの開発

第4図にグローバルシャッタ画素の構造図を示す.従来のCMOSイメージセンサでは、画素内にメモリーを設けることでグローバルシャッタ機能の実現を図っていたため、画素内に追加したメモリー部が光電変換部面積を 圧迫し、グローバルシャッタ機能搭載時には飽和信号量 減少という課題があった.そこで筆者らは、有機光電変 換膜に印加する電圧を変化させることのみで,光電変換 効率を制御することが可能な光電変換制御シャッタ技術 を開発した.本方式により,画素内にメモリー素子追加 の必要がなく飽和信号量の減少がないグローバルシャッ タ機能実現が可能となる.さらに光電変換部と蓄積部が 縦構造で分離されるため,新たな信号保持メモリーが不 要であり,遮光が容易なため,画素サイズ縮小,飽和性 能低下の課題を克服し,メモリー部への光の漏れ込みに より生じる寄生感度の抑制が可能である.





4.1 グローバルシャッタの動作原理

第5図(a) にグローバルシャッタの基本動作タイミン グを示す.露光時(=シャッタ開)は、ITO電圧にHigh 電圧を印加し、光電変換された信号電荷をFD部に保持す る.一方,遮光時(=シャッタ閉)は、ITO電圧を下げ、 上下電極間の電位差をゼロにする.有機光電変換膜内に 電界が生じないため、光入射により有機光電変換膜内で 発生した電子正孔対は電極側に引き抜かれることなく、 再結合し消滅させることができる.ITO電極はすべての



Fig. 5 Sensor operation timing

画素で共通に接続されるため、グローバルシャッタを実 現できる.その後、遮光状態で行走査を行い、FD部に蓄 積された信号電荷を順次読み出す.

4.2 グローバルシャッタの応用機能

第5図(b)に応用タイミングを示す.ITO電極にHigh 期間の異なる電圧をパルス状に複数印加することで,露 光期間の異なる多重露光が可能となる.また第5図(c) に示すようにITO電極に異なる電圧をパルス状に複数印 加することで,感度の異なる多重露光が可能となる.こ れにより,第5図(d)に示すように感度の濃淡により, 1回の撮像で動体の形状・動作方向を正確かつ瞬時に捉え ることができる.このように,ITO電極に印加する電圧 制御のみで,多機能なグローバルシャッタが可能となる.

5. イメージセンサ撮像実証と応用

120 dBを超えるWDR, 光電変換制御グローバルシャッ タの性能・機能を実証するため, 画素を2次元に複数配列 したイメージセンサチップを設計・試作した.

5.1 イメージセンサ試作チップと性能諸元

第6図にチップ写真を示す. 65 nm CMOSプロセスを用 いて,チップ試作を行った.本チップは1画素2セルの6 µm×6 µm画素が970×550画素配列されたセンサおよび, 3 µm×3 µm画素が画素数1920×1080で配列された画素 アレイのものを各々試作した.Sub-LVDSインターフェー スにより60 fpsで信号を出力する.

第1表に開発したチップ性能諸元を示す. 6 μm×6 μm の1画素2セル画素チップは, 飽和電子数600 ke-, トータ ルノイズ5.7 e-, うちリセットノイズ1.6 e-, 2セル間の感 度比14倍で, 完全同時ダイナミックレンジ124 dBを実現 している.



第6図 試作チップ写真 Fig. 6 Fabricated chip micrograph

第1表	性能諸兀	

l able 1	Chip characteristics
----------	----------------------

デバイス構成	有機膜+CMOS		
プロセス	65 nm CMOS 1P3Cu1Al		
センサタイプ	1画素2セル	グローバルシャッタ	
画素数(実効)	970×550	1920×1080	
画素サイズ [µm²]	6.0×6.0	3.0×3.0	
飽和電子数 [e-]	600k	50k, 210k	
ダイナミックレンジ [dB]	124	81	
ランダムノイズ [e-]	5.4	4.4	
フレームレート [fps]	60	60	

5.2 撮像実証とセンシング機能への応用

〔1〕120 dB WDR 撮像実証と応用

第7図(a)に試作した1画素2セルセンサで撮像した画像を示す.明暗差の非常に大きい高輝度ランプ前後の被写体(車や人形)を黒沈み,白飛びすることなくダイナミックレンジ広く撮像することに成功している.また,有機イメージセンサの広い回路領域をもつ構造を活かし,それぞれのセルに読み出し回路を独立に設けて大小2つのセルを同時に露光し,読み出すことができるため,第7図(b)に示すように高速な動体に対しても時間ずれなく正確なセンシングを可能にする.

さらに本構成により,近年車載カメラで課題となって いる,高速に点滅するLED標識のフリッカ課題に対して も有効な解決手段となる.本構成では,高飽和セルで100 倍明るい被写体を捉えることができるため,露光時間を 短くすることなく,1フレーム期間にわたり露光し続ける ことができる.そのため,**第8**図に示すようにLED点灯の タイミングによらず,すべての行においてLED点灯を捉 えることが可能となり,特別な対策構成や信号処理を追 加することなくLEDフリッカレス撮像を実現することが できる.

〔2〕光電変換グローバルシャッタ撮像と応用

3 μm×3 μm画素チップによる,光電変換制御のグロ ーバルシャッタ撮像例を示す.第9図(a)のローリング シャッタ動作による動体の画像歪み対して,第9図(b) のグローバルシャッタ動作により高速に回転する扇風機 の羽根の形を正確に捉えることができており,第9図(c) の露光時間を変えた多重露光に対しては1回の撮像でも 最適露光条件を得ることができ,羽根に書かれている文 字認識が可能であることがわかる.第9図(d)の感度の 異なる多重露光では,ボールの軌跡を捉え,感度の濃淡 から動き方向の情報を得ることに成功している.本構成 のグローバルシャッタ動作では,光電変換を行う有機薄 膜と,信号の電荷蓄積を行う回路部が独立な構造である ため,メモリー部FDが光電変換部を圧迫しないため,従 来CIS [2] 比10倍の業界最高飽和210ke-を実現している.





(b) 高速な動体の撮像例

第7図 ワイドダイナミックレンジ撮像例 Fig. 7 Wide-dynamic-range captured image



(a)従来 CMOS イメージセンサ

第8図 LEDフリッカレス撮像例

Fig. 8 LED flicker-free dynamic-range captured image



Fig. 9 Image captured with photoelectric-conversion-controlled global shutter

6. まとめ

有機光電変換膜をCMOSチップ上に積層した有機イメ ージセンサの広ダイナミックレンジ技術とグローバルシ ャッタ技術を開発した. 画素電極を大小に分割した1画素 2セル構造の提案により、従来技術課題であった時間ずれ なく1回の撮像で120 dBを超える完全同時広ダイナミッ クレンジ撮像を実証した.また、有機光電変換膜に印加 する電圧を変化させることで光電変換効率を制御する技 術を開発し、1回の撮像で動体・文字の認識や動き方向を 検出するグローバルシャッタ機能を実現した. さらに本 技術により従来技術課題であったグローバルシャッタ機 能搭載時の画素サイズと飽和のトレードオフ特性を飛躍 的に改善し、従来比10倍の業界最高飽和を実現した.こ れらの有機イメージセンサの特長を活かした高性能化・ 高機能化技術開発により,屋内外,逆光下など明暗差の 大きなシーンでの撮影や、高速に移動する被写体の認識、 動き方向検出を可能とすることで、従来の映像用途に加 えて、新たなイメージセンシング用途への展開・拡大が 期待される.

参考文献

- [1] 安富啓太 他, "グローバルシャッタCMOSイメージセンサ の開発動向,"映像情報メディア学会技術報告, vol.35, no.47, pp.1-8, 2011.
- [2] M. Sakakibara, et al., "An 83dB-Dynamic-Range Single-Exposure GICCobal Shutter CMOS Image Sensor with In-Pixel Dual Storage," ISSCC Dig. Tech. Papers, pp. 380-381, Feb. 2012.
- [3] B. Wolfs, et al., "3.5 µm Global Shutter Pixel with Transistor Sharing and Correlated Double Sampling," Proc. IISW, Utah, June 2013.

- [4] T. Kondo, et al., "A 3D Stacked CMOS Image Sensor with 16Mpixel Global-Shutter Mode and 2Mpixel 10000fps Mode Using 4 Million Interconnections," Dig. Symp. VLSI Circuits, pp. C90–C91, June 2015.
- [5] M. Mori, et al., "Thin Organic Photoconductive Film Image Sensors with Extremely High Saturation of 8500 electrons/µm2," Dig. Symp. VLSI Circuits, pp. T22–T23, June 2013.
- [6] M. Ishii, et al., "An Ultra-low Noise Photoconductive Film Image Sensor With a High-speed Column Feedback," Dig. Symp. VLSI Circuits, pp. C8–C9, June 2013.
- [7] S. Isono, et al., "A 0.9 µm pixel size image sensor realized by introducing organic photoconductive film into the BEOL process" Interconnect Technology Conference, pp.142-144, Jun 2013.
- [8] B. Pain et al., "Reset Noise Suppression in Two-Dimensional CMOS Photodiode Pixels through Column-based Feedback-Reset," Dig. VLSI 2002 IEDM Tech. Dig., pp.809-813, Dec. 2002.

執筆者紹介



村上雅史 Masashi Murakami 先端研究本部 光応用プロジェクト室 Applied Photoelectronics Research Lab, Advanced Research Div.







宍戸 三四郎 Sanshiro Shishido
先端研究本部 光応用プロジェクト室
Applied Photoelectronics Research Lab,
Advanced Research Div.
博士 (工学)



高瀬 雅之 Masayuki Takase 先端研究本部 光応用プロジェクト室 Applied Photoelectronics Research Lab, Advanced Research Div.



三宅 康夫Yasuo Miyake先端研究本部光応用プロジェクト室Applied Photoelectronics Research Lab,Advanced Research Div.



玉置 徳彦 Tokuhiko Tamaki
先端研究本部 光応用プロジェクト室
Applied Photoelectronics Research Lab,
Advanced Research Div.